

خواص ساختاری و ابرسانانی نمونه‌های $YBa_2Cu_{3-x}M_xO_y$ ($M = Ag, Al$)

سمیه فلاحتی، فاطمه صائب و وجید دادمهر

آزمایشگاه پژوهشی مغناطیس و ابرسانانی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهراء، کد پستی ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶، تهران، ایران
پست الکترونیکی: daadmehr@alzahra.ac.ir

چکیده

نمونه‌های بسیاری ابرسانانی $YBa_2Cu_{3-x}Ag_xO_y$ ($M = Ag, Al$) با مقادیر آلایش $x = 0/01, 0/02, 0/03, 0/045$ به روش سل-ژل ساخته شده‌اند. اندازه‌گیریهای مقاومت بر حسب دما (R-T) نشان می‌دهد که همه ترکیبات دارای گذار به حالت ابرسانانی بوده و دمای گذار این نمونه‌ها با افزایش میزان ناخالصی Ax تا مقادیر آلایش $0/15$ تا $0/015$ افزایش یافته و برای مقادیر بالاتر آلایش، کاهش می‌یابد، همچنین دمای گذار این نمونه‌ها با افزایش میزان ناخالصی Al کاهش می‌یابد. آزمایش‌های SEM بهبود خواص ساختاری نمونه‌ها را با آلایش Ag نشان می‌دهد. همگنی دانه‌ها با آلایش نقره افزایش یافته و اتصالات قویتری بین دانه‌ها برقرار شده است. برای تعیین ساختار فازهای تشکیل شده آزمایش‌های پراش پرتو-X (XRD) بر روی نمونه‌ها انجام شد. ساختاربلوری نمونه‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAUD طبقه‌سازی شد. نتایج نشان می‌دهند که جانشینی Ag در جایگاه (1) Cu انجام شده است. از بررسیهای انجام شده مقدار بهینه آلایش $0/15$ نقره گزارش می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ابرسانانی YBCO، آلایش نقره و آلومنیوم، سل-ژل، ارتباطات ضعیف

در این تحقیق اثر جانشینی نقره و آلومنیوم در ترکیب $YBa_2Cu_{3-x}M_xO_y$ ($M = Ag, Al$) را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. انتخاب نقره به این دلیل است که به عنوان یک عامل مؤثر در افزایش دمای گذار و رشد و جهت‌گیری دانه‌ای معروفی شده است [۲، ۳ و ۴]. در این تحقیق روش سل-ژل را بر اساس نتایج تحقیقات قبلی برای ساخت نمونه‌ها انتخاب کردیم [۵].

۲. جزئیات تجربی

برای بررسی اثرات جانشینی M/Cu ($M = Ag, Al$) در ساختار $YBa_2Cu_{3-x}Ag_xO_y$ با مقادیر آلایش $YBa_2Cu_{3-x}Al_xO_y$ ($x = 0/01, 0/02, 0/03, 0/045$)، نمونه‌های

پس از کشف ترکیب ابرسانانی $YBa_2Cu_3O_y$ جانشینی عناصر مختلف در جایگاه‌های اتمی متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. آلایش در ترکیب YBCO به دو دلیل صورت می‌گیرد: اولی تبیین خواص ابرسانانی ترکیب و دومی بهبود مشخصه‌های فیزیکی و بافت دانه‌ای است. به طور معمول در اولی جانشینی شیمیایی و در مورد دوم اضافه کردن فلز ناخالصی به سرامیک YBCO مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱]. از آنجاکه دو جایگاه اتمی مختلف Cu در ترکیب YBCO وجود دارد، اتم مس در زنجیره‌ها ($Cu(1)$) و اتم مس در صفحات ($Cu(2)$)، جانشینی در جایگاه Cu بسته به اینکه اتم آلاینده کدام جایگاه را اشغال می‌کند، منجر به خواص جالب و متفاوتی می‌شود.

نرم افزار MAUD و مقدار اکسیژن(y) اندازه‌گیری شده به روش یدومتری در جدول(۱) آمده است.

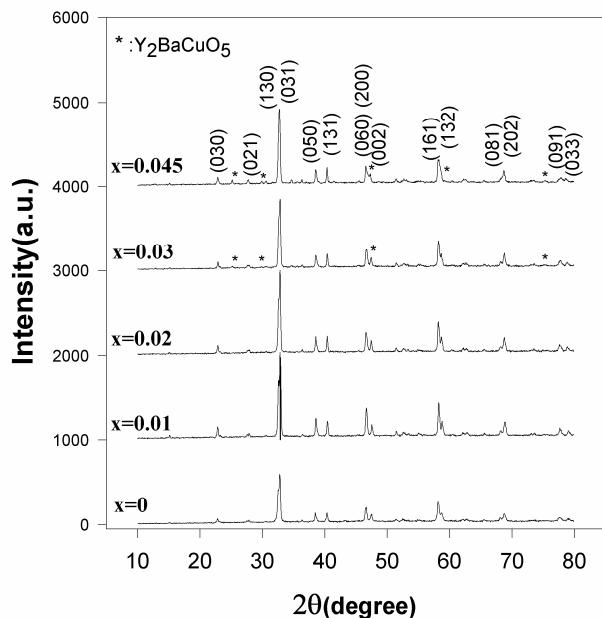
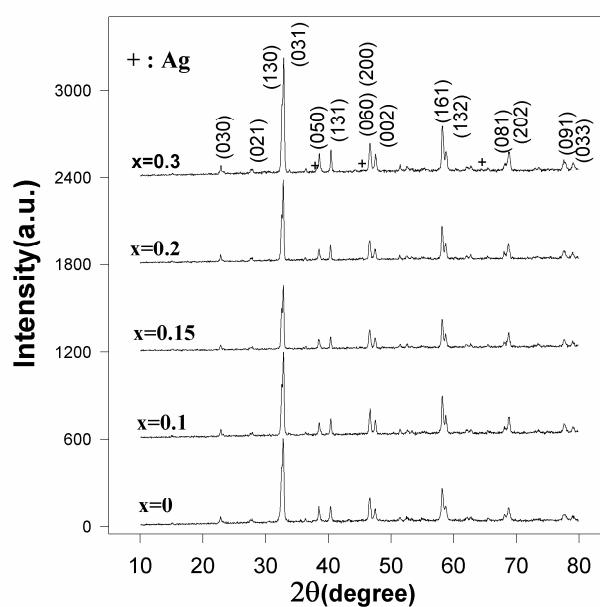
با افزایش میزان آلایش، تغییرات قابل توجهی در پارامترهای شبکه دیده نمی‌شود. عدم تغییر در اشغال محل $\text{Cu}_{(2)}$ ، کاهش کسر اشغال محل $\text{Cu}_{(1)}$ و افزایش کسر اشغال Ag و Al در جایگاه $\text{Cu}_{(1)}$ متناسب با افزایش مقدار آلایش، نشان می‌دهند که جانشینی‌ها در جایگاه $\text{Cu}_{(1)}$ انجام شده است. درجه اورتومبیستی نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ از $84^\circ/\text{د}$ در نمونه خالص به $59^\circ/\text{د}$ در نمونه با آلایش $45^\circ/\text{د}$ کاهش می‌یابد. شکل ۳ نتایج اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بر حسب دما و تراکم آلایش را برای نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ نشان می‌دهد. مقاومت حالت نرمال برای همه نمونه‌ها، رفتار فلزی داشته و شبیه آن مثبت است. دمای گذار نمونه‌ها با افزایش مقدار آلایش $\text{Ag}_{(1)}$ تا $15^\circ/\text{د}$ افزایش یافته و برای مقدار آلایش بالاتر آلایش کاهش می‌یابد. همان‌طور که می‌بینیم دمای گذار با آلایش Ag افزایش یافته که مؤید کارهای Am. Tepe و Ö. Gürler است [۲ و ۸]. علاوه بر این ثابت ماندن تقریبی ΔT_C با افزایش آلایش Ag نشان می‌دهد که Ag با یونهای موجود در محیط فاز ناخالصی خاصی را ایجاد نکرده است. بهینه مقدار آلایش Ag در ساختار ۱۲۳ مقدار $15^\circ/\text{د}$ معرفی شده که حداقل دمای گذار را ارائه می‌دهد. M. Tepe این مقدار را $2^\circ/\text{د}$ معرفی کرده است [۲]. شکل ۴ نتایج اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بر حسب دما و آلایش را برای نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ نشان می‌دهد.

مقاومت حالت نرمال برای همه نمونه‌ها، رفتار فلزی داشته و شبیه آن مثبت است و با افزایش مقدار آلایش Al افزایش افزایش می‌یابد و مؤید کار آر. وی. ووک و همکاران [۹] است. دمای گذار نمونه‌ها با افزایش آلایش Al به طور یک‌روند کاهش می‌یابد. روند کاهش دمای گذار ابررسانایی با آلایش Al در جانشینی Al/Cu نتایج کارهای تی. سیگریست [۱۰] و تار اسکن [۱۱] را تأیید می‌کند. بدلیل محدودیت اندازه‌گیری دمای گذار دستیابی به مقدار پاییتر T_C ممکن نبود. پهنای گذار

با مقدار آلایش $x = 0/045, 0/03, 0/02, 0/01, 0$ به روش سل- ژل ساخته شده‌اند [۶ و ۷]. آنالیز فازی نمونه‌ها بوسیله الگوی پراش اشعه-X (XRD، Philips Cu $\text{K}\alpha$ radiation) پودری تعیین می‌گردد. ریز ساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM، Philips XL30) مشاهده و مقاومت الکتریکی با استفاده از تکنیک چهار میله‌ای استاندارد برای K_{77-۳۰۰} اندازه‌گیری می‌شود.

۳. بحث و نتیجه‌گیری

خلوص فاز نمونه‌ها به کمک آنالیز XRD پودری مشخص شده‌اند. شکل (۱) الگوهای XRD نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ با مقدار تراکم آلایش $x = 0/0, 1/0, 15/0, 2/0, 3/0$ را نشان می‌دهد. از مقایسه این طیفها با کارتھای JCPDS می‌بینیم که فاز ۱۲۳ به همراه پیکهای مربوطه در زوایای مختلف در همه نمونه‌ها تشکیل شده است. ارتفاع پیک اصلی این نمونه ها در $2q = 34/87^\circ$ است که مربوط به صفحه (۳۱۰) می‌باشد. الگوهای پراش نمونه خالص و نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ با مقدار آلایش $x = 0/1, 0/15, 0/2$ هیچ پیک ناخالصی ندارند، بنابراین جانشینی Ag/Cu به خوبی و به طور کامل انجام شده و هیچ فاز ناخالصی در طول انجام فرآیند شکل نگرفته است. الگوی پراش XRD نمونه با $3/0 = \text{Ag}$ پیکهای خیلی ناچیزی از Ag را نشان می‌دهد، در نتیجه مقدار اضافی آلایش Ag در ساختار ۱۲۳ وارد نشده و در بین دانه‌ها باقی مانده است و نقش تقویت ارتباطات ضعیف را بازی خواهد کرد. شکل (۲) الگوهای XRD نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ را نشان می‌دهد. الگوهای پراش نمونه خالص و نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ با مقدار آلایش $x = 0/02, 0/01, 0/0$ هیچ پیک ناخالصی ندارند. الگوی پراش XRD نمونه با آلایش $x = 0/03$ پیکهای خیلی ناچیزی از Y_2BaCuO_5 را نشان می‌دهد که با افزایش مقدار آلایش در $x = 0/045$ شدت این پیکها کمی افزایش یافته است. ثابت‌های شبکه و مکانهای اتمی نمونه‌ها بدست آمده از

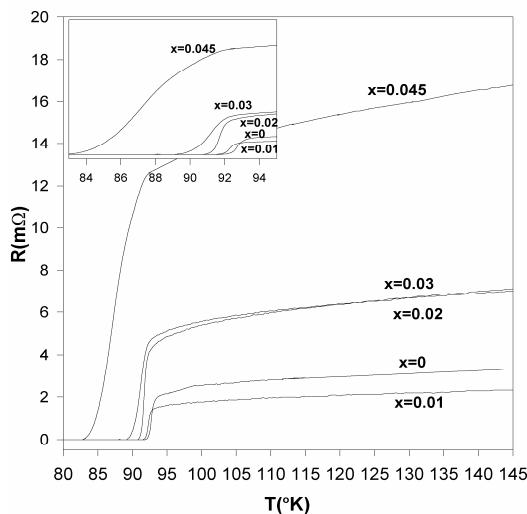
شکل ۲. الگوی پراش اشعه X نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ شکل ۱. الگوی پراش اشعه X نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ برای مقادیر آلایش $x = 0, 0.1, 0.2, 0.3$ جدول ۱. ثابت‌های شبکه و درصد اشغال مکانهای اتمی و مقدار اکسیژن در نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{M}_x\text{O}_y$ ($\text{M} = \text{Ag}, \text{Al}$)

$\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{M}_x\text{O}_y$	$a(\text{\AA})$	$b(\text{\AA})$	$c(\text{\AA})$	Orthorombicity	Cu(1) Occupancy	Cu(2) Occupancy	M Occupancy	y
$x = 0$	۳/۸۲۰	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۵	۰/۸۴۶۱	۱/۰۰	-	-	۷/۰۹
M=Ag $x = 0.1$	۳/۸۲۰	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۵	۰/۸۴۵۸	۰/۸۹۸۶	۰/۹۹۹	۰/۰۹۹۲	۷/۰
M=Ag $x = 0.15$	۳/۸۲۰	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۶	۰/۸۴۵۹	۰/۸۴۸۳	۰/۹۹۹	۰/۱۴۹۹	۷/۰
M=Ag $x = 0.2$	۳/۸۲۰	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۶	۰/۸۴۵۹	۰/۷۹۷۸	۰/۹۹۹	۰/۱۹۸۷	۷/۰۲
M=Ag $x = 0.3$	۳/۸۲۰	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۵	۰/۸۴۵۸	۰/۹۹۹۵	۰/۹۹۹	۰/۲۹۹۷	۷/۰
M=Al $x = 0.1$	۳/۸۲۰۴	۳/۸۸۵۶	۱۱/۶۸۳۷	۰/۸۴۶۸	۰/۹۸۳۸	۰/۹۹۶	۰/۰۰۷۹	۷/۰۹
M=Al $x = 0.2$	۳/۸۲۰۳	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۵	۰/۸۴۵۷	۰/۹۷۹۷	۱/۰۰۰۴	۰/۰۱۹۶	۷/۰۸۸
M=Al $x = 0.3$	۳/۸۲۰۳	۳/۸۸۵۵	۱۱/۶۸۳۵	۰/۸۴۵۶	۰/۹۶۹۶	۱/۰۰۰۱	۰/۰۲۹۰	۷/۲
M=Al $x = 0.45$	۳/۸۳۵۴	۳/۸۸۱۳	۱۱/۶۹۶۸	۰/۵۹۵۴	۰/۸۰۷۹	۱/۰۰۰	۰/۰۸۳۴	۷/۱۶

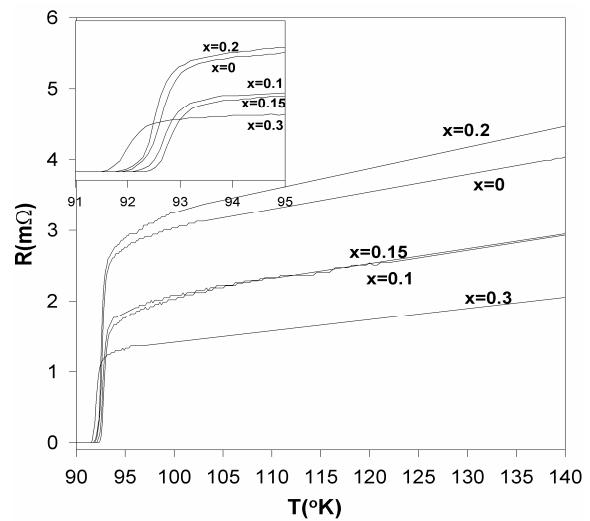
می‌گذارند.

شکل ۵ تصاویر SEM نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ را نشان می‌دهد که در آنها همگنی دانه‌ها با آلایش نقره افزایش یافته و ارتباطات قویتری بین دانه‌ها برقرار شده است. این در توافق با کار سی. لیبیوند- هارنویز و همکارانش است، که نشان دادند با آلایش نقره تخلخل نمونه کاهش یافته و ساختاری تقریباً عاری از هرگونه شکاف و حفره به دست

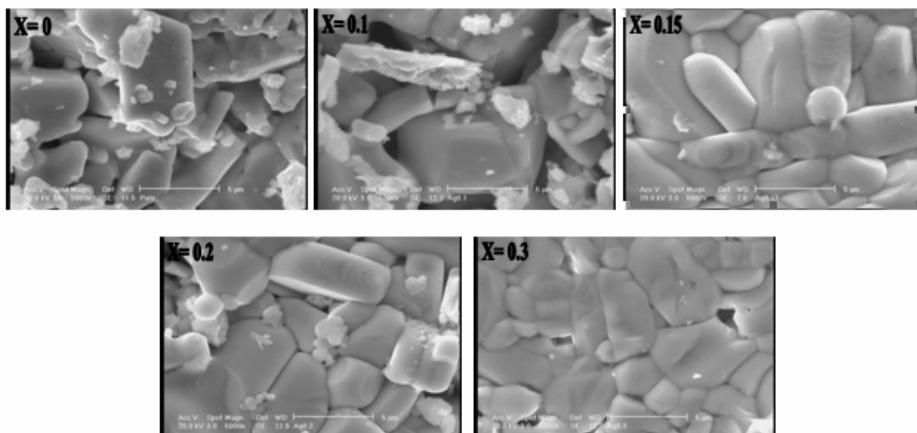
ابرزانایی با افزایش جانشینی Cu/Al افزایش یافته است. کاهش دمای گذار ابررسانش با آلایش Al را می‌توان به جانشینی آن در زنجیره‌های اتمی $\text{Cu}-\text{O}$ نسبت داد. از آنجا که Al^{3+} یک یون سه‌ظرفیتی است با جانشینی در زنجیره‌های اتمی، اکسیژن بیشتری را به سمت زنجیره‌ها جابه‌جا می‌کند، بنابراین حفره‌ها در زنجیره‌ها جایگزیده می‌شود [۱۲] و [۱۴]. بنابراین یونهای Al^{3+} بر جفت‌شدگی و انتقال بارها اثر



شکل ۴. مقاومت الکتریکی نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Al}_x\text{O}_y$ برای مقادیر آلایش $x=0-0/045$. شکل داخلی جزئیات گذار را نشان می‌دهد.



شکل ۳. نمودار R-T نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ برای مقادیر آلایش $x=0-0/3$. شکل داخلی جزئیات گذار را نشان می‌دهد.



شکل ۵. تصاویر SEM نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$

از رشد و جهت‌گیری دانه‌ای عمل می‌کند که کاملاً کار ام. تپه و همکارانش را تأیید می‌کند [۲].

۴. نتایج

اثر آلایش نقره و آلومینیوم در نمونه‌های ابررسانای $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{M}_x\text{O}_y$ ($\text{M}=\text{Ag}, \text{Al}$) مورد مطالعه قرار داده شده است. تصاویر SEM نمونه‌های $\text{YBa}_2\text{Cu}_{3-x}\text{Ag}_x\text{O}_y$ نشان می‌دهد که همگنی و سطح تماس دانه‌ها با آلایش نقره افزایش یافته و ارتباطات قویتری بین دانه‌ها برقرار شده است. جانشینی‌ها در جایگاه Cu(1) انجام شده است. مقدار بهینه

می‌آید [۴]. بنابراین انتظار داریم که آلایش نقره به افزایش J_c کمک کند. مقالات زیادی افزایش J_c در اثر آلایش Ag را گزارش کردند که افزایش سطح تماس دانه‌ها، تغییر در مرزهای بین دانه‌ای و رشد و جهت‌گیری مناسب دانه‌ها را علل اصلی افزایش چگالی جریان بحرانی با افزایش آلایش Ag معرفی کردند [۲، ۳، ۱۵ و ۱۹].

تصاویر SEM در شکل ۵ نشان می‌دهند که با افزایش مقدار آلایش نقره تا $x=0/15$ دانه‌ها رشد بهتری کرده‌اند، اما با آلایش اضافی نقره در $x=0/3$ دانه‌ها ریزتر شده‌اند. در نتیجه افزایش مقدار آلایش از حد بهینه به عنوان یک عامل بازدارنده

Al/Cu می‌شوند. افزایش جایگزینی حفره‌ای در اثر جانشینی Cu در صفحات CuO_2 می‌تواند یکی از علل کاهش T_C باشد.

قدرتانی

نویسنده‌گان از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا تشکر می‌کنند.

آلایش نقره 15° به دست آمد. افزایش مقدار آلایش از حد بهینه به عنوان یک عامل بازدارنده از رشد و جهت‌گیری دانه‌ای عمل می‌کند.

اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بر حسب دما برای مقادیر کم آلایش Al کاهش جزیی در دمای گذار را نشان می‌دهد اما با افزایش مقدار آلایش با افت سریع در دمای گذار (T_C) مواجه

مراجع

11. J M Tarascon, P Barboux, P F Miceli, L H Greene and G W Hull, *Phys. Rev. B* **37** (1988) 13.
12. M D Glinchuk and A P Pechenyi, *Ferroelectrics*, **155** (1994) 25-30.
13. Pinglin Li, Jincang Zhang, Guixin Cao, Chao Jing, and Shixun Cao, *Phys. Rev. B* **69** (2004) 224517.
14. S Schmenn, H. Lutgemeier, Th Wolf and E Brecht, *Journal of LOW Temprature Physics*, **105** (3-4) (1996) 425-430.
15. M J Qin, A W Kaiser and H J Bornemann, *Physica C* **311** (1999) 280–286.
16. E Mendoza, T Puig, E Varesi, A E Carrillo, J Plain and X Obradors, *Physica C* **334** (2000) 7–14.
17. C Harnois, G Desgardin, I Laffez, X Chaud and D Bourgault, *Physica C* **383**(2002) 269–278.
18. J Jung, I Isaac and M A-K Mohamed, *Phys. Rev. B* **49**(1993)10.
19. C H Cheng and Y Zhao, *Physica C* **463–465** (2007) 174.
1. J M S Skakle, *Materials Science and Engineering*, **R23** (1998)1-40.
2. M Tepe, I Avci, H. Kocoglu and D Abukay, *Solid State Communications* **131** (2004) 319–323.
3. G Bolaflos and P Prieto, *Physica C* 341-348 (2000) 1197.
4. C Lebiond-Harnois et al., *Physica C*, **341-348** (2000) 2439.
5. S Barekat Rezaee, V Daadmehr, and S. Dadras, *Fifth International Conference MSM* (2007) 93.
6. S Barekat Rezaee, V Daadmehr, F Saeb and S Falahati, *Fifth International Conference MSM* 31 (2007).
7. R S Liu, W N Wang, C T Chang and P T Wu, *Jpn. J. Appl. Phys.* **28** (1989) L2155-L2157.
8. O Gorur, T Kucukomeroglu, C Terzioglu, A Varilci and M Altunbas, *Physica C* **418** (2005) 35.
9. R V Vovk, et al., *Journal of Materials Science; Materials in Electronics*, **18** (2007)811-815.
10. T Siegrist, L F Schneemeyer, J V Waszczak, N P Singh, R L Opila, B. Batlogg, L W Rupp and D W Murphy, *Phys. Rev. B* **36**(1987)316.